

◆異物、不良解析、材料分析

試験法		試験項目	税別価格(円)
外観観察		基本料	5,000～
		写真撮影 1枚 (拡大鏡、マイクロスコープ等)	500
SEM観察	汎用SEM	前処理(試料の切断及び調整)	5,000～
		1視野	8,000
	FE-SEM	同一試料 2視野目以降	1,500
		1視野	10,000
異物調査	EDX分析	同一試料 2視野目以降	1,800
		1視野	18,000
		線分析	別途見積
		カラーマッピング	20,000
	FT-IR分析	前処理(試料の切断及び調整)	20,000
		通常測定 KBr・ATR・測定・解析	5,000～
		顕微法 測定・解析	18,000
		顕微法 同一試料分析箇所追加	18,000
		その他試料の調整	別途見積
			5,000～
破面解析		前処理(切断、洗浄等)	5,000～
		外観観察写真、解析	35,000～
		SEM観察画像等	
断面観察	金属組織等観察 形態観察など	試料調整(切断等)	5,000～
		埋込、研磨、エッチング処理	10,000
		CP加工(試料調整含む)	20,000～
表面観察	X線光電子分析 (XPS)	表面分析(ワイドスキャン測定 元素分析)	別途見積
		深さ方向分析	
形状測定、粗さ測定	共焦点顕微鏡観察	表面粗さ	別途見積
非破壊観察	マイクロフォーカス X線観察(2D,3D)	内部観察(欠陥検出等)	別途見積
		欠陥解析	
		繊維配向解析	

補足>

- ・通常の納期は、10日程度を基本としますが、別途ご相談させて頂く場合がございます。
- ・緊急対応の場合には、割増料金を頂く場合がございます。